

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2018614711

**Экспертная система по классификации дефектов топологии  
кристаллов интегральных микросхем**

Правообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)*

Авторы: *Вирясова Анастасия Юрьевна (RU), Власов Андрей Игоревич (RU), Гладких Алексей Алексеевич (RU), Резчикова Елена Викентьевна (RU)*

Заявка № 2018611706

Дата поступления 20 февраля 2018 г.

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 13 апреля 2018 г.

Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):  
2018614711

Дата регистрации: 13.04.2018

Номер и дата поступления заявки:  
2018611706 20.02.2018

Дата публикации и номер бюллетеня:  
13.04.2018 Бюл. № 4

Контактные реквизиты:  
patent.bmstu@mail.ni

Автор(ы):

Вирясова Анастасия Юрьевна (RU),  
Власов Андрей Игоревич (RU),  
Гладких Алексей Алексеевич (RU),  
Резчикова Елена Викентьевна (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
технический университет имени Н.Э. Баумана  
(Национальный исследовательский  
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)

Название программы для ЭВМ:

Экспертная система по классификации дефектов топологии кристаллов интегральных микросхем

**Реферат:**

Программа позволяет обработать цифровые данные фотографий топологии кристаллов интегральных микросхем, в частности при их дефектоскопии и может быть использована для оценки показателей качества поставляемых партий ИС и приборов. Программа может быть использована, например, для автоматизированного накопления статических данных об уровнях качества изготовления микросхем, а также для использования данных результатов отбраковки при прогнозировании наиболее вероятного срока активного функционирования поставляемых партий. Классификационная дефектоскопия поможет снизить степени риска комплектования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) ИС и приборов, не соответствующих требованиям к их конструктивно-технологическому исполнению.

**Язык программирования:** C++, Python

**Объем программы для ЭВМ:** 72 704 байт